# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000223453 A

(43) Date of publication of application: 11.08.00

(51) Int. Cl .

H01L 21/304 C09J 4/00

C09J 7/02

(21) Application number: 11025588

(22) Date of filing: 02.02.99

(71) Applicant:

NITTO DENKO CORP

(72) Inventor:

**AKAZAWA MITSUHARU** NAKAGAWA YOSHIO **FUKUOKA TAKAHIRO** HASHIMOTO KOICHI KUBOZONO TATSUYA

(54) SEMICONDUCTOR WAFER PROTECTIVE ADHESIVE SHEET, AND GRINDING METHOD OF SEMICONDUCTOR WAFER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain radiation-curing protective adhesive sheet which is capable of restraining a wafer from warping, after it is irradiated with radiation.

SOLUTION: A semiconductor wafer protective adhesive sheet is composed of a base film and an adhesive layer, to serve as a radiation-curing semiconductor wafer protective adhesive sheet, and the shrinking force of the adhesive layer is below

30 MPa, after it has been cured by radiation. The adhesive sheet comprises two types of adhesive layers, (i) one where 30 to 300 radiation-reactive oligomer which has 1 to 5 unsaturated bonds per molecule are compounded with 100 pts.wt. main polymer, that serve as a skeleton for the formation of an adhesive layer and other. is that 10 to 40: pts.wt. radiation-reactive oligomer which has 6 or more unsaturated bonds per molecule are compounded with 100 pts.wt. main polymer, that serve as a skeleton for the formation of an adhesive layer.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Pat nt Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

2000223453

**PUBLICATION DATE** 

11-08-00

APPLICATION DATE

02-02-99

**APPLICATION NUMBER** 

11025588

APPLICANT:

NITTO DENKO CORP:

INVENTOR

KUBOZONO TATSUYA;

INT.CL.

H01L 21/304 C09J 4/00 C09J 7/02

TITLE

SEMICONDUCTOR WAFER PROTECTIVE ADHESIVE SHEET, AND GRINDING

METHOD OF SEMICONDUCTOR WAFER

ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a radiation-curing protective adhesive sheet which

is capable of restraining a wafer from warping, after it is irradiated with radiation.

SOLUTION: A semiconductor wafer protective adhesive sheet is composed of a base film and an adhesive layer, to serve as a radiation-curing semiconductor wafer protective adhesive sheet, and the shrinking force of the adhesive layer is below 30 MPa, after it has been cured by radiation. The adhesive sheet comprises two types of adhesive layers, (i) one where 30 to 300 pts.wt. radiation-reactive oligomer which has 1 to 5 unsaturated bonds per molecule are compounded with 100 pts.wt. main polymer, that serve as a skeleton for the formation of an adhesive layer and (ii) the other is that 10 to 40 pts.wt. radiation-reactive oligomer which has 6 or more unsaturated bonds per molecule are compounded with 100 pts.wt. main polymer, that serve as a skeleton for the formation of

an adhesive layer.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-223453 (P2000-223453A)

(43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51) lnt.Cl.<sup>7</sup>
H 0 1 L 21/304
C 0 9 J 4/00

7/02

識別記号 631 FI H01L 21/304 C09J 4/00 7/02 デーマュート\*(参考) 631 4J004 4J040 Z

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平11-25588

(71)出顧人 000003964

日東電工株式会社

(22) 出願日 平成11年2月2日(1999.2.2)

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72)発明者 赤沢 光治

大阪府茨木市下穂積一丁目1番2号 日東

電工株式会社内

(72)発明者 中川 善夫

大阪府茨木市下穂積一丁目1番2号 日東

電工株式会社内

(74)代理人 100101362

弁理士 後藤 幸久

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 半導体ウエハ保護用粘着シート及び半導体ウエハの研削方法

#### (57)【要約】

【課題】 放射線照射後のウエハの反りを抑制できる放射線硬化型の半導体ウエハ保護用粘着シートを得る。

【解決手段】 半導体ウエハ保護用粘着シートは、基材フィルムと放射線により硬化する粘着剤層とで構成された放射線硬化型の半導体ウエハ保護用粘着シートであって、粘着剤層の放射線硬化後の収縮力が30MPa以下であることを特徴とする。このような粘着シートには、

(i) 粘着剤層に、1分子中に不飽和結合を1~5個有する放射線反応性オリゴマーが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して30~300重量部配合された粘着シート、(ii) 粘着剤層に、1分子中に不飽和結合を6以上有する放射線反応性オリゴマーが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して10~40重量部配合された粘着シートなどが含まれる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材フィルムと放射線により硬化する粘着利層とで構成された放射線硬化型の半導体ウエバ保護用粘着シートであって、粘着剤層の放射線硬化後の収縮力が30MPa以下であることを特徴とする半導体ウエハ保護用粘着シート。

【請求項2】 粘着剤層に、1分子中に不飽和結合を1 ~5個有する放射線反応性オリゴマーが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して30~300重量部配合された請求項1記載の半導体ウエハ保護用粘着シート。

【請求項3】 粘着剤層に、1分子中に不飽和結合を6以上有する放射線反応性オリゴマーが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して10~40重量部配合された請求項1記載の半導体ウエハ保護用粘着シート。

【請求項4】 粘着剤層に、1分子中に不飽和結合を1~5個有する放射線反応性オリゴマーと1分子中に不飽和結合を6以上有する放射線反応性オリゴマーとが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して総計20~300重量部配合された請求項1記載の半導体ウエハ保護用粘着シート。

【請求項5】 粘着剤層に、1分子中に不飽和結合を1~5個有する放射線反応性オリゴマーが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して10~300重量部配合され、且つ1分子中に不飽和結合を6以上有する放射線反応性オリゴマーが、該粘着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対して1~100重量部配合された請求項1記載の半導体ウエハ保護用粘着シート。

【請求項6】 粘着剤層が複数の層で構成されていると共に、各層の放射線硬化後の収縮率が基材フィルム側からウエハ当接側に向かって順次高くなるように形成されている請求項1記載の半導体ウエハ保護用粘着シート。 【請求項7】 ウエハの表面に請求項1~6の何れかの項に記載の半導体ウエハ保護用粘着シートを貼付してウエハの裏面を研削する半導体ウエハの研削方法。

【請求項8】 研削により、ウエハの厚み(μm)をウエハの直径(インチ)で割った値が27(μm/インチ)以下である半導体ウエハを得る請求項7記載の半導体ウエハの研削方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、各種半導体の製造工程のうち半導体ウエハの裏面を研削するバックグラインド工程において用いる放射線硬化型の半導体ウエハ保護用粘着シート、及び前記粘着シートを用いる半導体ウエハの研削方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】各種半導体を製造する際、半導体ウエハ

の表(おもて)面にパターンを形成した後、所定の厚さになるまでウエハ裏面をバックグラインダー等で研削するバックグラインド工程を経るのが一般的である。その際、ウエハの保護等の目的で、ウエハ表面に半導体ウエハ保護シート(テープ)なる粘着シートを貼り合わせた上で研削することが一般的に行われている。そして、最近では、直径8インチ又は12インチといったウエハの大型化や、ICカード用途などのウエハの薄型化が進んでおり、これに伴って、保護シートの軽剥離化のため放射線硬化型保護シートを用いる場合が多くなってきている。しかし、放射線硬化型保護シートは軽剥離化が可能な反面、放射線照射後にウエハが反りやすいという問題がある。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の 目的は、放射線照射後のウエハの反りを抑制できる放射 線硬化型の半導体ウエハ保護用粘着シート、及び放射線 を照射してもウエハの反りを極めて低いレベルに抑制で きる半導体ウエハの研削方法を提供することにある。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成するため鋭意検討した結果、半導体ウエハ保護用粘着シート(以下、「保護シート」又は「ウエハ固定用粘着シート」と称する場合がある)を構成する粘着層の放射線照射(硬化)後の収縮力を特定の値以下に設定すると、放射線照射を行っても半導体ウエハの反りが著しく小さいことを見いだし、本発明を完成した。

【0005】すなわち、本発明は、基材フィルムと放射線により硬化する粘着剤層とで構成された放射線硬化型の半導体ウエハ保護用粘着シートであって、粘着剤層の放射線硬化後の収縮力が30MPa以下であることを特徴とする半導体ウエハ保護用粘着シートを提供する。

【0006】また、本発明は、ウエハの表面に上記の半 導体ウエハ保護用粘着シートを貼付してウエハの裏面を 研削する半導体ウエハの研削方法を提供する。

【0007】なお、本明細書において、収縮力とは片持ち梁によって測定した粘着剤層単独の放射線硬化後の収縮力(放射線の照射による硬化により収縮したときに発生する力)であり、以下の方法により測定したものである。図1に示すように、燐青銅板A(長さ200mm、幅20mm、厚み200μm、JIS C 5210)に試料となる粘着剤層Bを貼り合わせ、長さ方向の片側を固定し、水平におく。その後、粘着剤層B側より紫外線を60秒間照射し(紫外線照射機:NEL UM-110、日東精機株式会社製)、常温に戻ってから、元の位置からの鉛直方向の変位δを測定し、下式により収縮力σを計算した(1Kg/mm²=9.8MPa)。【0008】

# $\rho = (L^2/8\delta) + \delta/2 = (L^2/8\delta)$

 $\sigma = (E_1 h_1^3 / 12 h_2) \times 2 / \rho (h_1 + h_2) \times \{1$ 

 $+ (h_1/(h_1+h_2)^2/3)$ 

ρ: 片持ち梁の曲率半径 (mm)

σ:内部応力(収縮力)(Kg/mm²)

h<sub>1</sub>: 燐青銅板の厚み (mm)

h2: 粘着剤層の厚み (mm)

L/2:支点/測定点間距離 (mm)

δ:試験片の変位量(mm)。

#### [0009]

【発明の実施の形態】本発明において、基材フィルムとしては、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、ポリブチレンテレフタレート(PBT)フィルム、ボリエチレンナフタレートフィルムをどのポリエステルフィルム;2軸延伸ポリプロピレン(OPP)フィルム、低密度ポリエチレン(PE)フィルム、各種軟質ポリオレフィンフィルムなどのポリオレフィン系フィルム;エチレン一酢酸ビニル共重合体(EVA)フィルム;などのプラスチックフィルム、及びこれらのフィルムを含む多層フィルムなどが挙げられる。なかでも、ウエハの反り抑制に効果のあるPETフィルム、PETフィルムを含む多層フィルム、OPPフィルムなどが好ましい。基材フィルムの厚みは、例えば20~300μm程度である。

【0010】粘着剤層を構成する粘着剤としては、アクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤等の適宜な粘着剤を用いることができる。なかでも、半導体ウエハへの接着性、剥離後のウエハの超純水やアルコール等の有機溶剤による清浄洗浄性などの点から、アクリル系ポリマーを主成分とするアクリル系粘着剤が好ましい。

【0011】前記アクリル系ポリマーとしては、例え ば、(メタ) アクリル酸アルキルエステル (例えば、メ チルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、イ ソプロピルエステル、ブチルエステル、イソブチルエス テル、sーブチルエステル、tープチルエステル、ペン チルエステル、イソペンチルエステル、ヘキシルエステ ル、ヘプチルエステル、オクチルエステル、2-エチル ヘキシルエステル、イソオクチルエステル、ノニルエス テル、デシルエステル、イソデシルエステル、ウンデシ ルエステル、ドデシルエステル、トリデシルエステル、 テトラデシルエステル、ヘキサデシルエステル、オクタ デシルエステル、エイコシルエステルなどの炭素数1~ 30、特に炭素数4~18の直鎖状又は分岐鎖状のアル キルエステルなど)、及び(メタ)アクリル酸シクロア ルキルエステル(例えば、シクロペンチルエステル、シ クロヘキシルエステルなど)の1種又は2種以上を単量 体成分として用いたアクリル系ポリマーなどが挙げられ

【0012】前記アクリル系ポリマーは、凝集力、耐熱性などの改質を目的として、必要に応じ、前記(メタ)アクリル酸アルキルエステル又はシクロアルキルエステ

ルと共重合可能な他のモノマー成分に対応する単位を含 んでいてもよい。このようなモノマー成分として、例え ば、アクリル酸、メタクリル酸、カルボキシエチルアク リレート、カルボキシペンチルアクリレート、イタコン 酸、マレイン酸、フマル酸、クロトン酸などのカルボキ シル基含有モノマー;無水マレイン酸、無水イタコン酸 などの酸無水物モノマー; (メタ) アクリル酸2-ヒド ロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロ ピル、(メタ)アクリル酸4-ヒドロキシブチル、(メ タ) アクリル酸6-ヒドロキシヘキシル、(メタ) アク リル酸8-ヒドロキシオクチル、(メタ) アクリル酸1 0-ヒドロキシデシル、(メタ)アクリル酸12-ヒド ロキシラウリル、(4-ヒドロキシメチルシクロヘキシ ル)メチルアクリレートなどのヒドロキシル基含有モノ マー;スチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、2-(メタ) アクリルアミドー2-メチルプロパンスルホン 酸、(メタ)アクリルアミドプロパンスルホン酸、スル ホプロピル (メタ) アクリレート、(メタ) アクリロイ ルオキシナフタレンスルホン酸などのスルホン酸基含有 モノマー; 2-ヒドロキシエチルアクリロイルホスフェ ートなどのリン酸基含有モノマーなどが挙げられる。こ れらのモノマー成分は1種又は2種以上使用できる。 【0013】さらに、前記アクリル系ポリマーにおい て、架橋処理等を目的として、多官能性モノマーなど も、必要に応じて共重合用モノマー成分として用いう る。このようなモノマーとして、例えば、ヘキサンジオ ールジ (メタ) アクリレート、(ポリ) エチレングリコ ールジ (メタ) アクリレート、(ポリ) プロピレングリ コールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコー ルジ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペンタエリスリトールトリ (メ タ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メ タ) アクリレート、エポキシアクリレート、ポリエステ ルアクリレート、ウレタンアクリレートなどが挙げられ る。これらの多官能性モノマーも1種又は2種以上用い ることができる。多官能性モノマーの使用量は、粘着特 性等の点から、全モノマー成分の30重量%以下が好ま

【0014】アクリル系ポリマーは、単一モノマー又は2種以上のモノマー混合物を重合に付すことにより得られる。重合は、溶液重合、乳化重合、塊状重合、懸濁重合等の何れの方式で行うこともできる。粘着剤層はウエハの汚染防止等の点から、低分子量物質の含有量が小さいのが好ましい。この点から、アクリル系ポリマーの数平均分子量は、好ましくは30万以上、さらに好ましくは40万~300万程度である。ポリマーの数平均分子量を高めるため、内部架橋方式又は外部架橋方式などの適宜な方法により架橋された架橋型ポリマーを用いることもできる。

【〇〇15】粘着剤層には放射線反応成分が配合され る。このような成分には、公知乃至慣用の放射線反応性 (放射線硬化性)オリゴマー及びモノマーが含まれる。 【0016】放射線反応性オリゴマーとして、例えば、 ウレタンオリゴマー、ポリエーテル系オリゴマー、ポリ エステル系オリゴマー、ポリカーボネート系オリゴマ ー、ポリブタジエン系オリゴマーなどが例示できる。こ れらの成分は1種または2種以上混合して使用できる。 【〇〇17】前記の放射線反応性オリゴマー等を含む混 合物を紫外線等により硬化させる場合に使用される光重 合開始剤として、例えば、4-(2-ヒドロキシエトキ シ)フェニル(2-ヒドロキシ-2-プロピル)ケト  $\lambda$ ,  $\alpha - \xi = \xi - \alpha$ ,  $\alpha' - \xi = \xi + \eta$ ン、2ーメチルー2ーヒドロキシプロピオフェノン、1 -ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンなどのα-ケトール系化合物;メトキシアセトフェノン、2,2-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノン、2,2-ジ エトキシアセトフェノン、2-メチル-1-[4-(メ チルチオ) -フェニル] -2-モルホリノプロパン-1 などのアセトフェノン系化合物:ベンゾインエチルエー テル、ベンゾインイソプロピルエーテル、アニソインメ チルエーテルなどのベンゾインエーテル系化合物;ベン ジルジメチルケタールなどのケタール系化合物:2-ナ フタレンスルホニルクロリドなどの芳香族スルホニルク ロリド系化合物:1-フェノン-1、1-プロパンジオ ン-2-(o-エトキシカルボニル) オキシムなどの光 活性オキシム系化合物:ベンゾフェノン、ベンゾイル安 息香酸、3、3、-ジメチル-4-メトキシベンゾフェ ノンなどのベンゾフェノン系化合物;チオキサンソン、 2-クロロチオキサンソン、2-メチルチオキサンソ ン、2,4-ジメチルチオキサンソン、イソプロピルチ オキサンソン、2、4-ジクロロチオキサンソン、2、 4ージエチルチオキサンソン、2,4ージイソプロピル チオキサンソンなどのチオキサンソン系化合物;カンフ ァーキノン:ハロゲン化ケトン;アシルホスフィノキシ ド;アシルホスフォナートなどが挙げられる。

【0018】粘着剤層の接着力は、使用目的等に応じて 適宜設定できるが、一般には、半導体ウエハに対する密 着維持性やウエハからの剥離性などの点から、ウエハミ ラー面に対する接着力(常温、180°ピール値、剥離 速度300mm/分)が、例えば100g/20mm以 上、放射線照射後のウエハミラー面に対する接着力が、 例えば40g/20mm以下であるのが好ましい。

【0019】粘着剤層の厚さは適宜に決定してよいが、 一般には1~300μm、好ましくは3~200μm、 さらに好ましくは5~100μm程度である。

【0020】本発明の重要な特徴は、粘着剤層の放射線 硬化後の収縮力が30MPa以下(好ましくは25MP a以下)である点にある。なお、前記収縮力の下限は、 特に限定されないが、例えば0.01MPa程度であ る。

【0021】半導体ウエハの表面に半導体ウエハ保護用 粘着シートを貼付し、ウエハの裏面を研削した後、例え ば紫外線などの放射線を照射すると、粘着シートの粘着 剤層が硬化し粘着力が低下するため、該粘着シートをウ エハから容易に剥がすことができる。その一方、前記放 射線照射時には、粘着剤層に体積収縮を起こし収縮力が 発生し、その結果としてウエハに反りが生じる。本発明 の粘着シートでは、この粘着剤層の放射線硬化後の収縮 力を30MPa以下に設定するため、放射線を照射して 粘着剤層を硬化させても、ウエハの反りは極めて小さ い。

【0022】粘着剤層の放射線硬化後の収縮力を30M Pa以下にする方法としては、例えば、(i)粘着剤層 に、低収縮性でありながら粘着力が低下するオリゴマ 一、例えば1分子中に不飽和結合(炭素-炭素二重結合 など)を1~5個有する低官能の放射線反応性オリゴマ ーを該粘着剤層において骨格となる主ポリマー (粘着剤 の主成分となるポリマー;例えば、前記アクリル系ポリ マー) 100重量部に対して、例えば30~300重量 部、好ましくは40~200重量部程度配合する方法、 (ii) 粘着剤層に配合する放射線反応性オリゴマーの量 を少なくする方法、より具体的には、粘着剤層に、量が 少なくても十分に粘着力が低下するオリゴマー、例えば 1分子中に不飽和結合(炭素-炭素二重結合など)を6 以上 (例えば6~12程度) 有する多官能の放射線反応 性オリゴマーを、該粘着剤層において骨格となる主ポリ マー100重量部に対して、例えば10~40重量部、 好ましくは15~35重量部程度配合する方法、(ii i) 粘着剤層に、前記1分子中に不飽和結合を1~5個 有する放射線反応性オリゴマー(低官能オリゴマー)と 前記1分子中に不飽和結合を6以上有する放射線反応性 オリゴマー (多官能オリゴマー)とを、該粘着剤層にお いて骨格となる主ポリマー100重量部に対して、例え ば総計20~300重量部、好ましくは30~200重 量部程度配合する方法、(iv) 粘着剤層に、前記1分子 中に不飽和結合を1~5個有する放射線反応性オリゴマ - (低官能オリゴマー)を、該粘着剤層において骨格と なる主ボリマー100重量部に対して、例えば10~3 00重量部、好ましくは20~200重量部程度配合す るとともに、前記1分子中に不飽和結合を6以上有する 放射線反応性オリゴマー(多官能オリゴマー)を、該粘 着剤層において骨格となる主ポリマー100重量部に対 して、例えば1~100重量部、好ましくは5~50重 量部程度配合する方法、(v)粘着剤層を複数の層で構 成するとともに、粘着剤層のウエハ側には比較的収縮力 の大きい層を形成して十分な粘着力低下を可能とし、粘 着剤層の基材側には収縮力の小さい層を形成する、例え ば、各層の放射線硬化後の収縮率を基材フィルム側から ウエハ当接側に向かって順次高くなるように形成し、粘

着剤層全体の収縮力を30MPa以下にする方法などが 挙げられる。

【0023】なお、前記(ii)の方法においては、放射線照射前の粘着力を一定のレベルに保持するため、粘着剤層において骨格となる主ボリマー(例えば、アクリル系ポリマー)として弾性率の低いボリマー、より具体的には、引張り貯蔵弾性率が0.5MPa以下のポリマーを選択するのが好ましい。

【0024】放射線反応性オリゴマー中の不飽和結合の数は、例えば、該オリゴマー(例えば、ウレタンオリゴマー)を合成するに際し、反応成分として用いる単量体中の反応性官能基の数(例えば、イソシアネート化合物中のイソシアネート基の数)や単量体比(例えば、イソシアネート化合物とヒドロキシル基含有不飽和化合物との比)などを適宜選択することにより調整できる。

【0025】本発明の半導体ウエハ保護用粘着シートは、慣用の方法、例えば、粘着剤、放射線反応性オリゴマー、光重合開始剤、及び必要に応じて、放射線反応性モノマー、慣用の添加剤、架橋剤等を含むコーティング液を前記基材フィルム上にコーティングすることにより製造できる。また、適当なセパレータ(剥離紙など)上に前記コーティング液を塗布して粘着剤層を形成し、これを前記基材フィルム上に転写(移着)することにより製造することもできる。

【0026】本発明の半導体ウエハ保護用粘着シートは、各種半導体の製造工程のうち半導体ウエハの裏面を研削するバックグラインド工程において半導体ウエハの保護のために用いることができる。本発明の粘着シートは、特に研削時に反りが発生しやすい大型ウエハ(例えば、直径8インチ又は12インチのウエハ)や薄型ウエハ(例えば、ICカード用などのウエハ)、とりわけ、研削により、ウエハの厚み(μm)をウエハの直径(インチ)で割った値が27(μm/インチ)以下である半導体ウエハを得る際の保護シートとして好適である。半導体ウエハには、シリコンウエハのほか、ガリウムーヒ素ウエハなどの汎用の半導体ウエハが含まれる。

【0027】半導体ウエハ保護用粘着シートの半導体ウエハ表面への貼着は、慣用の方法、例えば、自動貼付装置などにより行うことができる。また、このようにして表面に保護シートが貼付された半導体ウエハの裏面の研削(研磨)は、バックグラインダーなどの慣用の研削装置により行うことができる。ウエハ裏面の研削後、紫外線などの放射線を照射することにより、粘着シートを容易に剥離できる。

[0028]

【発明の効果】本発明によれば、粘着剤層の放射線照射 後の収縮力が特定の値以下に設定されているため、放射 線照射後のウエハの反りを顕著に抑制できる。

[0029]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいてより詳細に 説明するが、本発明はこれらの実施例により限定される ものではない。なお、ウエハ裏面のグラインドの条件、 UV照射条件等は下記の通りである。

グラインド装置: ディスコ社製 DFD-840 ウエハ: 6インチ径(600μmから100μmにバッ クグラインド)

ウエハの貼り合わせ装置: DR-8500II (日東精機 (株) 製)

紫外線 (UV) 照射装置: NEL UM−110 (日東 精機 (株) 製)

UV照射時間:10秒

また、グラインド後及びUV照射後のウエハの反り量は、図2に示すように、研削後のウエハを保護シートを貼ったままの状態で平坦な場所に置き、端部の浮いている距離(mm)を測定することにより求めた。粘着剤層のUV照射後(硬化後)の収縮力は、前記の方法により求めた。

## 【0030】実施例1

アクリル酸エチル50重量部、アクリル酸ブチル50重 量部及びアクリル酸5重量部からなる配合組成物をトル エン中で共重合させて、数平均分子量300000のア クリル系共重合物を含む重合組成物を得た。この重合組 成物に、前記アクリル系共重合物100重量部に対し て、1分子中に不飽和結合を6つ含むウレタンオリゴマ - [紫光UV-1700B、日本合成(株)製]30重 量部、ポリイソシアネート化合物5重量部、光開始剤 (イルガキュア184) 5重量部を混合して粘着剤組成 物を調製した。この粘着剤組成物を基材フィルムとして のエチレンー酢酸ビニル共重合体(EVA)フィルム (厚み110µm)に、乾燥後の厚みが30µmとなる ように塗工して粘着剤層を形成し、ウエハ固定用粘着シ ート(保護シート)を作成した。このようにして得られ たシートにシリコンウエハを貼り合わせ、上記の条件で ウエハ裏面をグラインドし、UV照射を行った。研削直 後及びUV照射後のウエハの反り量を測定した。結果を 表1に示す。

# 【0031】実施例2

アクリル酸エチル50重量部、アクリル酸ブチル50重量部及びアクリル酸5重量部からなる配合組成物をトルエン中で共重合させて、数平均分子量300000のアクリル系共重合物を含む重合組成物を得た。この重合組成物に、前記アクリル系共重合物100重量部に対して、1分子中に不飽和結合を6つ含むウレタンオリゴマー[紫光UV-1700B、日本合成(株)製]20重量部、1分子中に不飽和結合を2つ含むウレタンオリゴマー[UA-122P、新中村化学(株)製]50重量部、ポリイソシアネート化合物5重量部、光開始剤(イルガキュア184)5重量部を混合して粘着剤組成物を調製した。この粘着剤組成物を基材フィルムとしてのエ

チレンー酢酸ビニル共重合体 (EVA) フィルム (厚み 110μm) に、乾燥後の厚みが30μmとなるように 塗工して粘着剤層を形成し、ウエハ固定用粘着シート (保護シート)を作成した。このようにして得られたシートにシリコンウエハを貼り合わせ、上記の条件でウエハ裏面をグラインドし、UV照射を行った。研削直後及びUV照射後のウエハの反り量を測定した。結果を表1に示す。

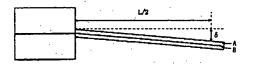
#### 【0032】実施例3

基材フィルムとしてポリエチレンテレフタレートフィルム(厚み50μm)を用いた以外は、実施例2と同様の操作を行い、ウエハ固定用粘着シート(保護シート)を作成した。このシートにシリコンウエハを貼り合わせ、上記の条件でウエハ裏面をグラインドし、UV照射を行った。研削直後及びUV照射後のウエハの反り量を測定した。結果を表1に示す。

#### 【0033】比較例1

アクリル酸エチル50重量部、アクリル酸ブチル50重 量部及びアクリル酸5重量部からなる配合組成物をトル エン中で共重合させて、数平均分子量300000のア クリル系共重合物を含む重合組成物を得た。この重合組 成物に、前記アクリル系共重合物100重量部に対し て、1分子中に不飽和結合を6つ含むウレタンオリゴマ ー [紫光UV−1700B、日本合成 (株) 製] 80重 量部、ポリイソシアネート化合物5重量部、光開始剤 (イルガキュア184)5重量部を混合して粘着剤組成 物を調製した。この粘着剤組成物を基材フィルムとして のエチレン-酢酸ビニル共重合体(EVA)フィルム (厚み110μm)に、乾燥後の厚みが30μmとなる ように塗工して粘着剤層を形成し、ウエハ固定用粘着シ ート(保護シート)を作成した。このようにして得られ たシートにシリコンウエハを貼り合わせ、上記の条件で ウエハ裏面をグラインドし、UV照射を行った。研削直 後及びUV照射後のウエハの反り量を測定した。結果を 表1に示す。

【図1】



#### 【0034】比較例2

基材フィルムとしてポリエチレンテレフタレートフィルム (厚み50μm)を用いた以外は、比較例1と同様の操作を行い、ウエハ固定用粘着シート (保護シート)を作成した。このシートにシリコンウエハを貼り合わせ、上記の条件でウエハ裏面をグラインドし、UV照射を行った。研削直後及びUV照射後のウエハの反り量を測定した。結果を表1に示す。

[0035]

【表1】

表 1

	粘着剤層の 収縮力	ウエハ反り量 (研削直後)	ウエハ反り量 (UV照射後)
実施例1	2 ИРа	1. 9 mm	2. 2 tmm
実施例2	1 MPa	1. 9 mm	2. 1 mm
実施例3	1 MPa	1.5mm	1.6 ===
比較例1	3 5 MPa	1. 9 mm	4. 1 mm
比較例2	3 5 MPa	1.5 mm	. 2.8 mm

表1より明らかなように、実施例のウエハ固定用粘着シートを用いてバックグラインドし放射線照射を行う場合には、比較例のウエハ固定用粘着シートに比べて、放射線照射後のウエハの反り量は極めて小さい。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】粘着剤層の放射線硬化後の収縮力の測定方法を 示す図である。

【図2】ウエハの反り量の測定方法を示す図である。 【符号の説明】

- A 燐青銅板
- B 粘着剤層
- 1 ウエハ
- 2 保護シート

【図2】.



#### フロントページの続き

#### (72) 発明者 福岡 孝博

大阪府茨木市下穂積一丁目1番2号 日東電工株式会社内

#### (72)発明者 橋本 浩一

大阪府茨木市下穂積一丁目1番2号 日東 電工株式会社内

## (72)発明者 久保園 達也

大阪府茨木市下穂積一丁目1番2号 日東 電工株式会社内 Fターム(参考) 4J004 AA01 AA05 AA07 AA10 AA11

AA14 AA15 AB06 CA03 CA04 CA06 CC02 CC03 CE01 FA04 FA05

4J040 CA051 CA052 DB091 DB092

DF011 DF012 DF041 DF042

DF051 DF052 DF061 DF062

DF101 DF102 DG001 DG002

DG021 DG022 EC321 EC322

EF221 EF222 FA271 FA272

FA281 FA282 FA291 FA292

GA02 GA05 GA07 GA08 GA11

GA19 GA22 GA25 GA27 JA09

JB07 JB09 LA11 MA01 NA20

PA42